**Боргардт, Николай Иванович.**

## Электронная микроскопия полупроводников с учетом реальных закономерностей освещения образца и рассеяния электронов : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.10. - Москва, 1999. - 335 с. : ил.

## Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Боргардт, Николай Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ДИФРАКЦИЯ ЧАСТИЧНО-КОГЕРЕНТНЫХ ПУЧКОВ ЭЛЕКТРОНОВ В

СОВЕРШЕННОМ КРИСТАЛЛЕ.

1.1. Использование функций взаимной когерентности и взаимной интенсивности для описания реальных электронных пучков.

1.2. Взаимная интенсивность на входной поверхности кристалла.

1.3. Взаимная интенсивность на выходе из кристалла.

1.3.1. Общий случай.

1.3.2. Падающий пучок с малой расходимостью.

1.3.3. Некогерентное освещение.

1.4. Интенсивность проходящего пучка электронов для клиновидного кристалла.

1.5. Контраст на изображении дефекта упаковки при частично-когерентном освещении.

1.6. Влияние когерентности освещения на распределение интенсивности на дифракционной картине.